



Figure S9. Transmission electron micrograph of the ZnO nanoparticles used in the electron transport layer. (Scale bar: 20 nm).

Supplementary References

- [1] T. R. Hebner, C. C. Wu, D. Marcy, M. H. Lu, J. C. Sturm, *Appl. Phys. Lett.* **1998**, *72*, 519.
- [2] H. Kobayashi, S. Kanbe, S. Seki, H. Kiguchi, M. Kimura, I. Yudasaka, S. Miyashita, T. Shimoda, C. R. Towns, J. H. Burroughes, R. H. Friend, *Synth. Met.* **2000**, *111-112*, 125.
- [3] T. Gohda, Y. Kobayashi, K. Okano, S. Inoue, K. Okamoto, S. Hashimoto, E. Yamamoto, H. Morita, S. Mitsui, M. Koden, *Dig. Tech. Pap. - Soc. Inf. Disp. Int. Symp.* **2006**, *37*, 1767.
- [4] H. M. Haverinen, R. A. Myllylä, G. E. Jabbour, *Appl. Phys. Lett.* **2009**, *94*, 073108.
- [5] V. Wood, M. J. Panzer, J. Chen, M. S. Bradley, J. E. Halpert, M. G. Bawendi, V. Bulović, *Adv. Mater.* **2009**, *21*, 2151.
- [6] J. Han, D. Ko, M. Park, J. Roh, H. Jung, Y. Lee, Y. Kwon, J. Sohn, W. K. Bae, B. D. Chin, C. Lee, *J. Soc. Inf. Disp.* **2016**, *24*, 545.
- [7] C. Jiang, Z. Zhong, B. Liu, Z. He, J. Zou, L. Wang, J. Wang, J. Peng, Y. Cao, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2016**, *8*, 26162.
- [8] Y. Liu, F. Li, X. Xie, W. Chen, Z. Xu, C. Zheng, H. Hu, T. Guo, *Dig. Tech. Pap. - Soc. Inf. Disp. Int. Symp.* **2017**, *48*, 1715.
- [9] Y. Liu, F. Li, Z. Xu, C. Zheng, T. Guo, X. Xie, L. Qian, D. Fu, X. Yan, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2017**, *9*, 25506.
- [10] C. Jiang, L. Mu, J. Zou, Z. He, Z. Zhong, L. Wang, M. Xu, J. Wang, J. Peng, Y. Cao, *Sci. China: Chem.* **2017**, *60*, 1349.